

JIS

導電性プラスチックの4探針法 による抵抗率試験方法

JIS K 7194⁻¹⁹⁹⁴

(2008 確認)

平成 6 年 12 月 1 日 制定

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

主 務 大 臣：通商産業大臣 制定：平成 6. 12. 1

官 報 公 示：平成 6. 12. 5

原案作成協力者：財団法人 高分子素材センター

審 議 部 会：日本工業標準調査会 高分子部会（部会長 三田 達）

この規格についての意見又は質問は、工業技術院標準部繊維化学規格課（〒100 東京都千代田区霞が関1丁目3-1）へ連絡してください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第15条の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

導電性プラスチックの4探針法による
抵抗率試験方法

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	参考 2.	$\cos(\xi x_D) \cosh\left[\xi\left(y_D + \frac{b}{2}\right)\right]$	$\cos(\xi x_D) \cosh\left[\xi\left(y_D + \frac{b}{2}\right)\right]$

平成 15 年 7 月 24 日作成

白 紙

導電性プラスチックの4探針法 による抵抗率試験方法

K 7194-1994

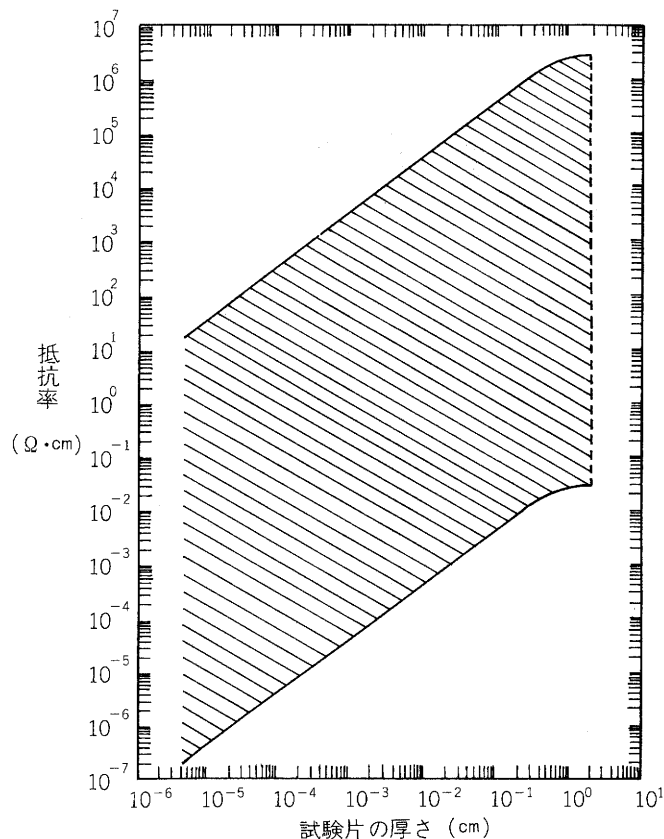
Testing method for resistivity of conductive plastics
with a four-point probe array

1. 適用範囲 この規格は、導電性プラスチックの抵抗率を4探針法によって試験する方法について規定する。

備考1. この規格は、導電性プラスチックが絶縁材料に塗布又は積層されている場合、導電性プラスチックだけの厚さが測定できるか、厚さの公称値が分かっているときには適用できるが、導電性プラスチックの厚さが分からない場合は適用できない。

2. この規格によって測定できる抵抗率は、図1に示す斜線部分の範囲である。

図1 抵抗率の測定範囲



3. この規格の引用規格を、次に示す。

JIS B 7502 マイクロメータ

JIS B 7507 ノギス

JIS K 6900 プラスチック用語

JIS K 7100 プラスチックの状態調節及び試験場所の標準状態

JIS Z 8401 数値の丸め方